

組織委員 (五十音順・敬称略)

【委員長】 佐藤 吉信 東京海洋大学 教授 海洋工学部 海事システム工学科
【副委員長】 木村 忠正 電気通信大学 名誉教授
【委員】 荒木 伸行 パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株) 品質管理センター
 品質評価グループ 評価解析チーム 主任品質技師
 井原 惇行 楠木化成(株) エタック事業部 顧問
 岩間 英雄 日本CMO(株) 社長付
 岡田 孝雄 宇宙航空研究開発機構 研究開発本部
 構造・機構グループ 耐環境構造セクション 研究員
 岡田 誠一 (株)村田製作所 品質保証部 自動車・新規事業信頼性技術課
 兼 品質企画戦略課 担当部長
 尾畑 義雄 関西電力(株) 企画室品質管理グループ チーフマネージャー
 門田 靖 (株)リコー 品質本部 信頼性技術室 室長
 鎌田 信也 三菱重工業(株) 原子力事業本部 原子力技術センター
 原子力技術部 部長代理
 上久保 忠正 (株)日立製作所 品質保証本部 QAセンタ 主任技師
 関 清伸 富士通(株) 品質保証本部 品質保証推進統括部 リーダー
 佐々木 健二 ソニー(株) 半導体事業本部 品質信頼性部門 信頼性技術部 担当部長
 佐藤 廣幸 アイシン精機(株) 解析・制御技術部 部長
 田中 健次 (株)デンソー 本社 品質管理部 第1品質監査室 主任部員
 電気通信大学 教授 大学院情報システム学研究所
 手塚 泉 (株)ルネサステクノロジ 品質保証統括部
 汎用デバイス品質保証部 信頼性技術グループ グループマネージャ

中條 聡 (株)東芝 品質統括本部 品質推進室 参事
 二川 清 NECエレクトロニクス(株) 生産本部 テスト評価技術部
 シニアプロフェッショナル
 仁田 周一 サレジオ工業高等専門学校 教授(東京農工大学 名誉教授)
 布谷 貞夫 (株)小松製作所 開発本部 主幹
 藤本 直伸 三菱電機(株) 鎌倉製作所 宇宙システム部
 宇宙部品エンジニアリング課 課長
 藤本 良一 (株)HII 航空宇宙事業本部 技師長
 堀籠 教夫 東京商船大学 名誉教授
 益田 昭彦 帝京科学大学 客員教授 生命環境学部 環境科学科
 宮村 鐵夫 中央大学 教授 理工学部 経営システム工学科
 向殿 政夫 明治大学 教授 理工学部 情報科学科
 村上 孝 (株)日本航空インターナショナル 整備本部 品質保証部
 副部長/品質マネジメント室長
 森川 明彦 JSR(株) 製品・品質保証部長
 山 悟 富士ゼロックス(株) R&D企画管理部 マネージャー
 山田 雄愛 名城大学大学院 客員教授
 若井 一顕 第一工業大学 教授 情報電子システム工学科
【顧問】 佐々木 正文 防衛大学校 名誉教授
 堀見 弘 日本科学技術連盟 参与
 額田 啓三 元 日東電工(株) 技師長
 真壁 肇 東京工業大学 名誉教授
 三根 久 京都大学 名誉教授

参加申込方法

「参加申込書」に必要事項をご記入の上、下記宛にFAX・郵送にてお申し込みください。
 また、ホームページから「参加申込書」をダウンロードし、E-mailでお申し込みも可能です。
 「開催通知」「参加券」「請求書」は、開催1ヶ月前からご送付いたします。参加費は、請求書発行後2ヶ月以内に、請求書に記載してある銀行口座へお振り込みください。

参加費 (税込)

一般39,900円
 日科技連賛助会員 (後援・協賛団体会員)37,800円
 学生 (学生割引)5,250円
 共同執筆者 (発表1件につきお一人)18,900円
 2009年度RDT研究会・R-Map実践研究会・SQiP研究会会員18,900円
 JCRE登録者18,900円

※参加費は、当日欠席されてもお返しいたしかねますので、ご了承ください。
 ※参加者以外、報文集は配付いたしません。また、報文集のみの頒布はいたしませんので、ご了承ください。

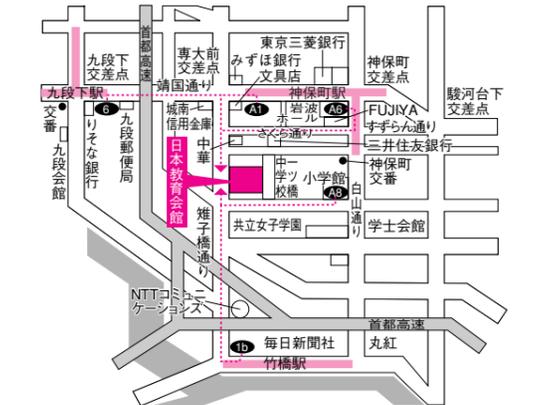
参加申込先

**財団法人日本科学技術連盟
 セミナー受付グループ**
 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1
 TEL: 03-5378-1217 FAX: 03-5378-1220
 e-mail: regist@juse.or.jp
 日科技連ホームページ: http://www.juse.or.jp

シンポジウム内容に関する問合せ先

**財団法人日本科学技術連盟
 教育推進部第3課 信頼性担当**
 TEL: 03-5378-9850 FAX: 03-5378-9842
 e-mail: re-group@juse.or.jp

会場案内



日本教育会館 東京都千代田区一ツ橋2-6-2
道案内専用電話: 03-3230-2833
 ●東京メトロ半蔵門線「神保町」駅下車 (A1出口) 徒歩約3分
 ●地下鉄都営三田線「神保町」駅下車 (A8出口) 徒歩約5分
 ●東京メトロ東西線「竹橋」駅下車 (北の丸公園側出口) 徒歩約5分
 ●JR総武線「水道橋」駅下車 (西口出口) 徒歩15分

JULY 13-14, 2009 The 39th Symposium on Reliability and Maintainability

R&M参加者募集のご案内

テーマ：信頼性と安全性の接点

2009年7月13日(月)～14日(火)

会場：日本教育会館 (東京・千代田区一ツ橋)

主催：財団法人日本科学技術連盟

<http://www.juse.or.jp/>

後援：日本信頼性学会
 協賛：(社)情報処理学会 (社)電子情報通信学会 (社)電気学会 (社)日本品質管理学会 (社)日本機械学会 (社)日本自動車部品工業会
 (順不同) (社)日本オペレーションズ・リサーチ学会 (社)計測自動制御学会 (社)日本航空宇宙学会 (社)日本航空技術協会
 (財)日本電子部品信頼性センター (社)自動車技術会 (社)応用物理学会 IEEE Reliability Society Japan Chapter

参加のおすすめ

1971年に開始した当シンポジウムは、いろいろな分野の信頼性・保全性に携わるエンジニア、マネージャー、研究者の方々にご参加いただき、研究発表、事例発表、討論などを行うとともに、基調講演、特別講演、チュートリアルセッション、展示コーナーなど、多彩な人的交流と情報交換の場を提供することを主眼として開催しており、国内外から高い評価を得ております。

今回のシンポジウムは、「信頼性と安全性の接点」をテーマに、例年通り開催いたします。
 今日の激動する世界経済下にあつて、なお一層のこと安心・安全が求められています。アイテムの安心感と安全性には、多くの要因が関係しますが、とりわけアイテムが故障しない性質、いつでも使用できる状況、そして問題が生じないことが必要条件になります。すなわち、広い意味での信頼性と安全性との両立が必要です。ますます複雑化するアイテムにおいて、これを実現させるために、幅広い議論を通して、信頼性と安全性との共通点と相違点との理解を深めていきます。

貴社の信頼性活動を一層発展させるためにも、是非ともご参加ください!

基調講演	特別講演
 「信頼性と安全性の接点」 佐藤 吉信氏 東京海洋大学教授 組織委員会委員長	 「地震予知の現状と 社会の安全」 -現在の太陽の異常も含めて- 芳野 越夫氏 電気通信大学 名誉教授

チュートリアルセッション

- 「MEMSの信頼性」**
 MEMSの信頼性 三浦 英生 氏(東北大学大学院 教授)
- 「製品安全の重要性と最近の動向」**
 (独)製品評価技術基盤機構(NITE)の活動と最近の動向について 長田 敏 氏(独)製品評価技術基盤機構
 製品の安全と安心について 宮村 鐵夫 氏(中央大学教授)
 改正消費生活用製品安全法において義務づけられたこと(誤使用・点検制度)に対する取り組み 山口 憲一 氏(株)ノーリツ
- 日科技連「R-Map実践研究会」の活動から**
 R-Map手法を活用したPS-PTA手法の開発と実践 巻島 文夫 氏(日立アプライアンス(株))
 R-Mapによる開発段階からの安全構造設計(製品安全寿命の立証方法の提案) 菊池 敏郎 氏(2008年度R-Map実践研究会
 第1分科会/東芝テック(株))
 事故調査におけるR-Map活用事例 久本 誠一 氏(独)製品評価技術基盤機構

第39回 信頼性・保全性シンポジウム 参加申込書

FAX: 03-5378-1220

●参加者 ※参加区分を必ずご記入ください。

記入不要	参加者名 (ふりがな)	所属事業所・部課・役職・E-mail
		所属・役職:
参加区分	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 会員 (No.) <input type="checkbox"/> 共同執筆者 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 研究会会員	E-mail:
		所属・役職:
参加区分	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 会員 (No.) <input type="checkbox"/> 共同執筆者 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 研究会会員	E-mail:

●連絡担当者 (お申込み受理後「開催通知」「参加券・請求書」等をお送りする方)

会社名	事業所	担当者	電話
所属・役職			FAX
所在地			会員番号
E-mail			
後援・協賛団体の名称			

参加費(税込)	1. 一般	39,900円	×	名	円
	2. 日科技連賛助会員 (後援・協賛団体会員)	37,800円	×	名	円
	3. 学生 (学生割引)	5,250円	×	名	円
	4. 共同執筆者 (発表報文No.)	18,900円	×	名	円
	5. 2009年度RDT研究会・R-Map実践研究会・SQiP研究会会員	18,900円	×	名	円
	6. JCRE登録者 (登録No.)	18,900円	×	名	円

※お支払いにつきましては、お申込み受理後、請求書と開催通知を併せてお送りいたしますので、請求書発行後2ヵ月以内にお支払いください。
 ※ご記入いただきました企業・組織及び個人情報につきましては、参加申込受付処理ならびに日科技連からの事業情報のご送付のために使用させていただきます。

第39回 信頼性・保全性シンポジウム

R&M 第39回 信頼性・保全性シンポジウム プログラム

【テーマ：信頼性と安全性の接点】

2009年7月13日(月)～14日(火) 日本教育会館(東京・千代田区一ツ橋)
 【受付】エレベータホール前 9:00～11:00

●一般発表：41件、チュートリアル講演：11件 合計：52件
 ●発表時間：持ち時間は1件につき30分(発表20分、質疑応答10分)

(敬称略)

7月13日(月)	会場：A会場 第一会議室 (総司会：仁田 周一 サレジオ工業高等専門学校教授・組織委員会委員)				2008年度(第38回)R&MS推奨論文賞・奨励論文賞 表彰論文						
	発表時間	A会場(第一会議室) 8階801～804 [300席]		司会者(補佐)	B会場(第二会議室) 8階805～806 [168席]		司会者(補佐)	C会場(新会議室) 7階 707室 [108席]		司会者(補佐)	展示会場(第三会議室) 8階807～808
9:30-9:35	主催者挨拶：財日本科学技術連盟役員										
9:35-10:20	基調講演：「信頼性と安全性の接点」 佐藤 吉信 東京海洋大学教授・組織委員会委員長										
10:20-10:45	2008年度(第38回)R&MS推奨論文賞・奨励論文賞 表彰式 賞状・副賞の授与：佐藤 吉信 東京海洋大学教授・組織委員会委員長 選考理由について：木村 忠正 電気通信大学教授・報文小委員会委員長										
10:45-10:55	休憩										
10:55-12:25	特別講演：「地震予知の現状と社会の安全-現在の太陽の異常も含めて-」 芳野 起夫(電気通信大学 名誉教授)										
12:25-12:30	事務連絡：日科技連事務局										
12:30-13:45	昼食休憩(展示コーナー(第三会議室)は12:00～17:00まで開催しておりますので、お時間のある時には是非お立ち寄りください)										
13:45-14:15	1-1	航空機の信頼性管理における破面解析/化学分析事例 株式会社日本航空インターナショナル 高木 晴之		NECエレクトロニクス 二川 清(岡田孝)	【Session 3】MEMSの信頼性 【Tutorial Session 1】MEMSの信頼性 13:45-13:50 チュートリアルセッションの趣旨説明 株式会社リコー 門田 靖		門田 靖(手塚)	【Session 5】信頼性・安全性管理1 5-1 鋼トラス橋材の補修・補強・予防保全およびリダダンシーに関する2,3の検討 トビー工業株式会社 林 健治		宮村 鐵夫(仁田)	〈1日目〉
14:15-14:45	1-2	積層セラミックコンデンサの外部電極への機械的ストレスの評価法 株式会社村田製作所 酒井 俊彦			T1-1 13:50-15:00 MEMSの信頼性 東北大学大学院 教授 三浦 英生			5-2 配管系のフロー供給維持のための故障対策検討支援システムの開発 京都大学 密岡 洋介	〈2日目〉		
14:45-15:15	1-3	クラッチディスクかきめ部の故障解析による設計手法の確立 アイシン精機株式会社 熊岡 剛			3-1 15:00-15:15 質疑応答			5-3 統合的設計管理手法の研究(その1) -多目的トレードオフ設計とリスク管理の統合- 株式会社HI 呉宏 堯	10:00-15:00		
15:15-15:45	1-4	HALTと三要素FMEAを組み合わせた未然防止型信頼性マネジメントの提案 帝京科学大学 益田 昭彦			3-1 LSIプロセス診断法によるMEMSデバイスの評価試行 沖エンジニアリング株式会社 矢部 一博			5-4 統合的設計管理手法の研究(その2) -片持ち梁問題による多目的トレードオフ設計法の解説- 株式会社HI 森 初男	[出展会社]		
15:45-16:15	休憩(展示コーナー(第三会議室)は12:00～17:00まで開催しておりますので、お時間のある時には是非お立ち寄りください)										
16:15-16:45	2-1	微小結露試験方法および試験装置の開発 エスベック株式会社 田中 浩和		帝京科学大学 益田 昭彦(田中完)	【Session 4】FMEA・FTA 4-1 「品質問題」を無くす設計と設計審査 株式会社デンソー 本田 陽広		鎌田 信也(藤本良)	【Session 6】信頼性・安全性管理2 6-1 安全と安心を作り込む戦略的高信頼性組織への挑戦 ~航空会社の整備技術部門における高信頼性戦略の現状~ 全日本空輸株式会社 黒木 英昭		明治大学 向殿 政男(山田雄)	①テックサポートマネジメント(有)
16:45-17:15	2-2	微小結露試験装置を使用したマイグレーション不具合に関する電圧及び結露量加速性評価 株式会社村田製作所 岡本 朗			4-2 ライフセーフエンド設計をにらんだFTAの考察 安信経営工学研究所 柴田 義文			6-2 航空機整備におけるヒューマンエラー削減の取り組みについて 株式会社日本航空インターナショナル 渋江 尚夫	②楠本化成株式会社		
17:15-17:45	2-3	ACCELERATED LIFE TEST OF HALOGEN LAMP CONSIDERTING QUALITATIVE DEGRADATION CHARACTERISTICS Reliability Technology Center Sang-Woo, Yu			4-3 FTA作成支援ツールの開発 ジヤトコ株式会社 平岡 洋二			6-3 衛星開発におけるシステム安全管理活動の紹介 三菱電機株式会社 森 康	③株式会社東陽テクニカ		
17:45-18:15	2-4	Reliability Estimation for Current Sensor using Accelerated Life Test Korea Electronics Technology Institute Je Min, Kim			4-4 FF式石油温風暖房機の安全解析(その3) 東京海洋大学 西 干機			6-4 水力発電の溢水低減に向けた取り組み 関西電力株式会社 奥出 邦夫	④日科技連出版社		
9:30-10:00	7-1	【Session 7】半導体の信頼性1 BGA実装の信頼性と問題点 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 中川 彬		ソニー 佐々木 健一(門田)	【Tutorial Session 2】製品安全の重要性と最近の動向 9:30-9:35 チュートリアルセッションの趣旨説明 電気通信大学 田中 健次		田中 健次(電気通信大学)	【Tutorial Session 4】最新信頼性・安全性解析(展示企業の発表) T4-1 Reliability Studio 信頼性工学ソリューション OPUS10 稼働率/スベアパーツ最適化ソリューション テックサポートマネジメント(有) 原 良孝		井原 惇行(二川)	株式会社デンソー 田中 克幸
10:00-10:30	7-2	半導体の各静電破壊試験方法の市場相関性の検討 株式会社ルネサステクノロジ 田中 政樹			T2-1 9:35-10:20 (独)製品評価技術基盤機構(NITE)の活動と最近の動向について (独)製品評価技術基盤機構 長田 敏			T4-2 HALT後進国 日本への警鐘 株式会社東陽テクニカ 川上 雅司	楠本化成株式会社 井原 惇行		
10:30-11:00	7-3	パッケージの気密信頼性評価技術 三菱電機株式会社 衣川 勝			T2-2 10:20-10:50 製品の安全と安心について 中央大学 宮村 鐵夫			T4-3 HALT試験の故障モードと解析事例 楠本化成株式会社 小林 吉一	NECエレクトロニクス株式会社 二川 清		
11:00-11:30	7-4	高輝度白色LEDの信頼性向上 韓国電子部品研究所 Byung Jin, Ma			T2-3 10:50-11:20 改正消費生活用製品安全法において義務づけられたこと(誤使用・点検制度)に対する取り組み (株)ノーリツ 山口 憲一			T4-4 信頼性評価の可視化技術 楠本化成株式会社 井原 惇行			
11:30-12:30	昼食休憩(展示コーナー(第三会議室)は10:00～15:00まで開催しておりますので、お時間のある時には是非お立ち寄りください)										
12:30-13:00	8-1	【Session 8】半導体の信頼性2 半導体プロセス制御幅のTCAD/PCM(プロセス・コンパクト・モデル)による適正化 東芝インフォメーションシステムズ株式会社 江口 英孝		ルネサステクノロジ 手塚 泉(荒木)	【Tutorial Session 3】日科技連「R-Map実践研究会」の活動から 12:30-12:45 日科技連「R-Map実践研究会」の活動 R-Map実践研究会統括主査 松本 浩二		松本 浩二(製品評価技術基盤機構)	【Session 11】ソフトウェアの信頼性 11-1 ソフトウェア製品評価に有効な連続的リスクアセスメント手法 株式会社ニルソフトウェア 河合 一夫		佐藤 吉信(関)	
13:00-13:30	8-2	フラッシュメモリのデータリテンション特性における書き込み/消去条件依存性 株式会社東芝 船津 剛			T3-1 12:45-13:20 R-Map手法を活用したPS-PTA手法の開発と実践 日立アプライアンス株式会社 巻島 文夫			11-2 電気自動車「i MIEV」のソフトウェア信頼性 ~HILSを用いた分散制御システムのソフトウェア検証~ 三菱自動車工業株式会社 徳永 哲智			
13:30-14:00	8-3	認定評価における初期故障率の検証 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 松岡 敏成			T3-2 13:20-13:55 R-Mapによる開発段階からの安全構造設計 (製品安全寿命の立証方法の提案) 2008年度 R-Map実践研究会 第1分科会(東芝テック株式会社) 菊池 敏郎			【Session 12】信頼性手法 12-1 モンテカルロシミュレーションを用いた冗長システムのアンペアバリティ解析(その3) 東京海洋大学 西 干機			
14:00-14:30					T3-3 13:55-14:30 事故調査におけるR-Map活用事例 (独)製品評価技術基盤機構 久本 誠一			12-2 リスク評価による鉄道信号装置の改善手法の検討 鉄道総合研究所 岩田 浩司			
14:30-15:00	休憩(展示コーナー(第三会議室)は10:00～15:00まで開催しておりますので、お時間のある時には是非お立ち寄りください)										
15:00-15:30	9-1	【Session 9】ワイブルとデータ解析 3パラメータワイブル分布のパラメータ推定における非正規性問題の回避に関する一考察 首都大学東京 長塚 豪己		IHI 藤本 良(堀籠)	【Session 10】信頼性設計 10-1 信頼性の位置づけ-信頼性教育- 日本CMO株式会社 岩間 英雄		山 悟(荒井)	【Session 13】信頼性・安全性管理3 13-1 新聞報道による金融情報システム事故情報の分析と改善への活用 電気通信大学 坂東 幸一		村上 孝(尾畑)	
15:30-16:00	9-2	赤池情報量基準を用いた定数打ち切りデータにおけるパラメータ変化時点の推定 防衛大学校 田村 信幸			10-2 宇宙船設計支援システムの研究 宇宙航空研究開発機構 角 有司			13-2 新製品開発と技術アライアンスにおける意思決定メカニズムの研究 中央大学 神津 壮			
16:00-16:30	9-3	故障データベースに基づく製品の寿命特性の推定 電子通信大学 栗原 裕太			10-3 AMT(オートメテッド・マニュアルトランスミッション)失速感フィーリングの定量化 アイシン精機株式会社 橋 敦之			13-3 Research on the Safety Improvement Method for the company's RAMS management business and public infrastructure POSCON Myung-Seon Ryou			